ヨウ素安定化光源の短期周波数安定度向上とデジタル制御

武者研究室

1. はじめに

重力波は超巨大質量の非対称運動や、質量変化によ って発生する空間の歪みである。空間の歪みの伝搬で あることから、電磁波で捉えることのできなかった物 理現象を観測する新しい道具として注目されている。 この重力波の特徴として、四重極変位で伝搬すること や、距離の相対変位量が微小であることが挙げられ る。距離の相対変位量はdL/L < 10⁻²³と非常に小さな 値であるために検出が困難であった。この重力波を観 測する手法として主流になっているのが、直交座標系 であるレーザーを用いたマイケルソン干渉計である。 マイケルソン干渉計が一つの光源からの光を二つの光 路に分けたのちに鏡で反射させて再び合波、干渉させ る干渉計である。重力波が干渉計を通過すると、光路 の一方が伸びてもう一方が縮むために得られる干渉強 度が変化する。この強度変化によって重力波を検出す る。本研究室では、重力波検出器に用いるレーザー光 源の開発を行っており、今回、周波数安定化光源の短 期的な周波数安定度の向上とデジタル制御に関する研 究を行った。

2. 重力波検出計画 DECIGO

2.1 重力波検出機

現在、世界各国で重力波検出を行う計画が進められ ており、稼働しているものはアメリカの adv.LIGO や欧 州の VIRGO が挙げられる。これらの重力波検出器はす でに重力波を検出しており、重力波天文学を進展させ ている。重力波検出器は干渉計の腕の長さや防振系に よって異なる周波数特性を有しているため、複数の重 力波検出器を用いて観測することによって、広帯域の 重力波観測が可能になる。また、重力波がそれぞれの 重力波検出器へ到達する時間差を利用することで重力 波の発生方向を特定することが可能であるため、重力 波の同時観測がなされている。日本では大型低温重力 波検出器 KAGRA が完成し、運転中である。この KAGRA は神岡鉱山の地下に存在し、地面振動を抑える 他、ミラーを極低温に冷やすことによって熱雑音を低 減している。これにより、低周波数域の感度を向上さ せている。日本では KAGRA 以外にも重力波検出計画 が進められている。

2.2 宇宙重力波検出器 DECIGO

現在日本で進められているもう一つの計画が宇宙で 重力波を検出する計画である DECIGO だ。DECIGO は DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory の 略称であり、0.1~10Hz の帯域に存在する重力波をター 大塚俊介

ゲットとした重力波検出計画である。低周波数域の重 力波の検出感度限界は検出器の基線長と地面振動でリ ミットされてしまうため、長基線長を確保しつつ地面 振動の無い宇宙空間で重力波を検出する計画である。 宇宙での重力波検出計画は他に LISA が存在する。

図1はDECIGOの概略図となっており、3機の人工 衛星を一辺1000kmの正三角形の頂点に配置して編隊 飛行させる。基線長1000kmのF・Pマイケルソン干渉 計を3台構築し、重力波の検出を狙う。本研究室では DECIGOに用いるレーザー光源の開発を行っている。 光源の周波数雑音の要求値は1Hz/√Hz@1Hzであり、非 常に低い周波数雑音となっている。この目標値を達成 するために我々はヨウ素を周波数基準とした安定化光 源を開発している。本研究では、このヨウ素安定化光 源の短期周波数安定度の向上と、周波数安定化用サー ボ回路のデジタル化に関して報告を行う。



図1 DECIGO の概略図

3. ヨウ素安定化光源の短期安定度向上

3.1 実験原理

本研究室では、DECIGO 用光源としてヨウ素安定化光 源を開発している[1]。周波数安定化光源の実験系を図2 に示す。マスター光源として Fiber DFB レーザーを使用 し、第2高調波発生によって得られる 515 nm のビーム を使用してヨウ素分子の 515 nm に存在する飽和吸収線 を周波数基準として周波数の安定化を行っている。

Fiber DFB レーザーからの 1030 nm のレーザーを手製 の Yb-Doped Fiber Amplifier(YDFA)で増幅した後、インラ イン型アイソレーターを通過し非線形結晶に入射され る。この非線形結晶である Periodically –Poled Lithium Niobate(PPLN)の第二高調波発生により、波長を 1030 nm から 515 nm に変換する。変換された光を空間系に出射 し、偏光ビームスプリッターによって s 偏光と p 偏光に 分ける。s 偏光を励起光、p 偏光を信号光とする。励起光 には電気光学変調子(Electro-optical Modulator, EOM)を用



いて位相変調を加えた後に二枚のレンズを用いてビー ム径を拡大させてヨウ素を封入したガラスセルに入射 させる。ガラスセルの窓はブリュースター角になってい るため、波長板を用いて偏光の調整を行う。信号光は音 響光学素子(Acoust-Optic modulator, AOM)を用いて 80 MIz の周波数シフトを与えた後にビーム径を拡大させて ヨウ素封入セルに入射させる。励起光と信号光の2つの ビームをヨウ素分子封入セルに同軸に対向入射させる ことによって飽和吸収分光を行うことができる。また、 励起光にのみ位相変調を加えているが、四光波混合によ って励起光から信号光に位相変調が変調移乗する (Modulation Transfer Spectroscopy, MTS)。その後、信号光 を受光し、復調することによって周波数弁別信号(図 3) を得ることができる。



図3 周波数弁別信号

周波数弁別信号は飽和吸収線の微分信号であり、周波数 変化を電圧変化として取得することができる。したがっ て、電圧を一定にするようにマスター光源に対してフィ ードバックを行うことで周波数を安定化させることが できる。

In-loop での周波数雑音では目標値である 1 Hz/ $\sqrt{\text{Hz}}$ @1Hzを達成している(図4)が、in-loop での測 定は信号への追従度を表しているため、絶対評価である out-of-loop 評価を行う必要がある。



図4 in-loop での周波数雑音スペクトル

out-of-loop 評価においては周波数安定化光源を二台用 意し、そのビート周波数の美位相雑音スペクトルから周 波数雑音スペクトルを計算している(図 5)。ビート周波 数の周波数雑音スペクトルとして24 Hz/√Hz@10Hz を達 成しているが、目標である1 Hz/√Hz@1Hz を達成することは できていない。目標への追従度では目標値を達成しているため、 周波数弁別信号の S/N の向上が必要である。今回、周波数弁別 信号の S/N を向上させるためにヨウ素を分光する際の条件の 最適化を行った。10³



図5 ビート周波数の周波数雑音スペクトル

3.2 分光条件の最適化

前段にて、周波数弁別信号の S/N によって周波数雑音 がリミットしていることに関して言及したが、この周波 数弁別信号の S/N は以下の要因によってきまる。 まず、周波数弁別信号の大きさは吸収線の選択、分子封 入セルの気圧、相互作用長、分光に用いるビームの強度 によって左右される。雑音に関しては光源の強度雑音や 干渉雑音、原理的な限界であるショット雑音のいずれか によって支配されている。

図1の実験系での分光パラメータとして、吸収線の選 択、分子封入セルの温度、相互作用長などがあるが、こ れらのパラメータは最適な値としており[1]、それぞれ、 P29(43-0) a₂₀、1Pa、120 cm となっている。今回は分光 の際のヨウ素セルに入射するビームの強度に関しての 実験を行った。

ビーム強度は、分光時にセルに入射する励起光と信号 光のビーム強度であり、それぞれを変化させて S/N を計 算する。S/N の信号に相当するものとしては取得する周 波数弁別信号の大きさ Vp-p である。また、雑音は周波 数弁別信号の 10 Hz での雑音である。10Hz で測定を行 う理由としては、位相雑音スペクトルを測定する測定器 の測定限界が 10Hz であるためである。雑音の測定方法 としては、図3のような共鳴点での測定が必要となるが、 ヨウ素分子と共鳴している際には光源の雑音が支配的 となってしまい、周波数弁別信号の雑音値を測定するこ とができない。そのため、ヨウ素分子とビームが共鳴し ていない非共鳴点での雑音値を近似として使用した。 結果を図6に示す。



ヨウ素セルに入射する信号光の強度を上げていくと周 波数弁別信号の大きさと雑音値のどちらも増加するよ うな傾向を得た。信号光を強くすることによる周波数弁 別信号の大きさの増加は線形的であったが、雑音の増加 が非線形であったために図6のような曲線を描いている。 信号光を強くすることで PD での受光量が増えるととも に光源由来の雑音もしくは干渉雑音が増加しているこ とが考えられる。また、ヨウ素セルに入射する励起光の 強度を増加させた場合には雑音の増加が見られずに、周 波数弁別信号の大きさの増加が見られた。位相変調は励 起光に加えているため、信号光への位相変調の変調移乗 が多くなり、周波数弁別信号の大きさが増加したものと 考えられる。

次に、得られた S/N から周波数雑音を予測した。周波 数弁別信号を用いて周波数安定化をおこなう際には周 波数弁別信号の傾きを実際には使用している。そのため、 得られた S/Nを使用する飽和吸収線の半値全幅で割るこ とによって周波数雑音を予想することができる。計算し た結果を図7に示す。



図7分光に用いるビームの強度と 予想される周波数雑音

図7では、パワーブロードニンングの影響が少ないと仮 定して半値全幅を632 Hz として計算を行なっている。 予想される周波数雑音がもっとも低い場合で

11.6 Hz/ $\sqrt{\text{Hz}}$ @10 Hz であった。10 Hz で雑音値を測定しているが、雑音測定では1Hz まで平坦な特性を得ることができていたため、予想される周波数雑音は1Hz と10 Hz では同じ値である。

次に、二台の周波数安定化光源のビーム強度を先ほどの周波数雑音がもっとも低いとされる条件で周波数安定化し、ビート周波数からビート周波数の位相雑音スペクトルを測定し、周波数雑音スペクトルを計算した。測結果を図8に示す。分光時のビーム強度を最適化することによって、ビート周波数の周波数雑音として16Hz/√Hz@10Hzを達成し、8Hz/√Hz向上させることができた。この値はビート周波数であるため、マスター光源の周波数雑音としては11.4 Hz/√Hz@10Hz であり、予想していた結果とほぼ等しい値となった。このことから、非共鳴時の雑音値を利用し、簡易に周波数雑音の予測が可能であることがわかった。

しかし、目標である1 Hz/√Hz@1Hz を達成できていな いため、さらなる S/N の向上が必要である。そこで、雑 音源の特定を行なった。



図8 分光時の殖度を最適化後の周波数雑音スペクトル

3.3 雑音源の特定

周波数弁別信号の雑音源として、光源の強度雑音や干 渉雑音が挙げられる。まずは、光源の強度雑音に関して の実験を行った。

現在マスター光源には FiberDFB レーザーを利用して いた。しかし、FiberDFB レーザーは位相変調周波数であ る 200 kHz 付近に緩和発振を有しているため光源の交換 が検討されており、交換後の光源として本研究室で作成 された外部共振器型半導体レーザー(ECLD)が挙げられ ていた(図 9)。これまで、1030 nm での相対強度雑音のみ を測定していたため、515 nm での相対強度雑音を測定し た。結果を図 10 に示す。





図 10 相対強度雑音の比較 @515 nm

1030 nm 光から SHG により 515 nm に変換した後も変調 周波数 200 kHz にて FiberDFB レーザーよりも低い雑音 を得ることができた。次に、復調後の雑音値の比較を行 った。ヨウ素の分光は行わない状態で、FiberDFB レーザ ーのビームを受光して 200 kHz で復調した際の雑音値、 同相雑音を除去する差動受光法を用いた際の FiberDFB レーザーの 200 kHz で復調後の雑音、ECLD のビームを 受光して 200 kHz で復調した際の雑音値の 3 つを比較し た。結果を図 11 に示す。



図11 復調後の雑音値の比較

ECLD の雑音値が FiberDFB レーザーよりも 15dB 以上低 い結果が得られた。また、差動受光法を用いた FiberDFB レーザーと同じ雑音レベルであったが、ECLD のビーム を受光する際に差動受光法を使用しても雑音値が変化 しなかったことから、受光系もしくは復調系によるリミ ットが存在すると考えられる。この実験で PD に入射す るビーム強度は、3.3 章でのビーム強度を最適化した際 のPDの受光値と等しくなるようにNDフィルタを用い て減光した。この実験で得られた雑音値は分光の実験で 得られていた雑音値よりも低い値であった。そのため、 周波数弁別信号の雑音を支配している要因が他にある と考え、分光系の途中で雑音が発生していることを考え、 ヨウ素安定化光源のビームをピックオフして雑音を測 定した。結果として、ヨウ素セル中にて雑音が増加して いることがわかった(図 12)。



この雑音はヨウ素分子と非共鳴時には見られなかった ことから、この雑音はヨウ素分子の吸収放出に起因して いることが考えられる。今後、この雑音を低減すること が必要となる。また、分光時のビーム径の拡大による取 得線幅の狭窄化などにより周波数雑音を低減すること が可能であると予想されるため、様々な手法で周波数雑 音の低減を行う予定である。

4. デジタル化

ョウ素安定化光源の周波数安定化では、現在アナログ のサーボフィルターを用いているが、周波数安定化の全 自動化と利便性の面からオールデジタル化を目指して いる。今回はサーボフィルタのデジタル化を目標に実験 を行なった。

4.1 サーボフィルタ

現在周波数安定化に用いているサーボフィルタを図 13 に示す。



図13 周波数安定化に用いているサーボフィルタ

この回路は多段のラグリード回路で構成されており、低 域に利得が存在する回路になっている。この回路のブロ ック図は図14のようになっている。



図14 サーボフィルタのブロック図

図 14 のようなブロック図の回路を FPGA によって作成す ることが望ましいが、FPGA を用いたサーボフィルタの実 装が初めてであったために、まずは、簡単な PID 制御回 路を用いた実験を行った。

4.2 FPGA を用いた PID 制御

使用した FPGA は Xilinx Zynq 7010 SOC Xilinx Zynq 7010 SOC で ADC は 125MS/s, 14bit を搭載した CPU 付きのハードウェアである。この FPGA に PID 制 御コードを実装し、アナログ回路で等価回路を作成し て比較を行った。実験結果を図 15 に示す。実験では、 一次の完全積分回路を実装している。



図 15 FPGA とアナログ回路での周波数特性の比較

図 15 より、FPGA で一次の完全積分回路の特性を得 ることができていることがわかる。利得に関しては、 アナログ回路よりも低い値となっているが、直線的な 特性を得ることができているため、利得を調整するこ とで使用可能と判断した。また、位相に関してはオフ セットが見られるが、このオフセットは測定系によっ て発生しているものである。位相変化に関してはアナ ログ回路よりも FPGA の方が位相変化が小さい結果 が得られた。この結果に関しては検討中ではあるが、 アナログ回路よりも良い特性が得られたため、位相に 関しても使用できると考えられる。

4.3 FPGAを用いた周波数安定化

現在のヨウ素安定化光源での制御機器は図 16 のように接続されている。現在使用しているアナログのサ ーボフィルタを FPGA とアナログ回路の二種類の完 全積分回路に置き換えて周波数安定化を行なった。結 果を図 17 に示す。



図16 ヨウ素安定化光源の制御回路接続



サーボフィルタを完全積分回路に置き換えた状態で 周波数安定化を行い、オープンループ伝達特性を測定 したが、FPGAとアナログ回路で同一の特性を得るこ とができた。位相は図 15 での特性のようにアナログ 回路よりも FPGA は位相変化が少なく、アナログ回路 よりも良い特性を得ることができた。この時の、inloop での周波数雑音スペクトルを図 18 に示す。



In-loop での周波数雑音スペクトルにおいても、FPGA とアナログ回路とで、同一の特性を得ることができた。

FPGA でのサーボフィルタは実装が容易である。また、 FPGA ボードさえあれば同一の性能の回路を作成可 能である点から、様々な研究に使用できると考えられ る。現段階では PID 回路以外の回路実装はできてい ないため、今後、現在使用しているサーボフィルタを FPGA に実装していく予定である。また、サーボフィ ルタの一部をデジタル化できたため、周波数安定化の 全自動化も進める予定である。

5 まとめ

5.1 ヨウ素安定化光源の短期安定度向上

分光の条件の一つである信号光と励起光の強度を 最適化することにより、周波数雑音11.6 Hz/ √Hz@10Hzを達成した。また、光路中で発生している 雑音を特定できた。

今後、発生している雑音の低減もしくは、取得線幅 の狭窄化などによって周波数雑音を低減する予定で ある。

5.2 デジタル化

FPGA に PID 制御回路を実装し、アナログ回路との 特性比較を行った。また、FPGA を用いてヨウ素安定 化光源の周波数安定化を行なった。単純な構成のサー ボ回路のために目標値は達成できていない。今後、現 在使用しているアナログのサーボフィルタを FPGA に実装することや、周波数安定化の全自動化を目指す。

参考文献

[1] Aru Suemasa 'Highly Stable Laser for Space Gravitational Wave Detector:DECIGO' 電気通信大学 博士論文

発表実績

[1]大塚 俊介,末正 有,赤見 恵,中森 真輝,下奥 あゆ美, 武 者 満、第62回宇宙科学技術連合講演会(久留米) 2018 年 10月 24 日

[2]大塚 俊介,濱口 太一,中森 真輝,末正 有,武者 満 日本物理学会 2019 年秋季大会(山形) 2019 年 9 月 13 日 [3]大塚 俊介,末正 有,中森 真輝,濱口 太一,武者 満 第 63 回宇宙科学技術連合講演会(徳島) 2019 年 11 月 6 日